

TÈCNIC/A DE SUPORT A LA RECERCA 150-710-245

DADES DE L'OFERTA

Unitat Adscripció: Enginyeria Electrònica**Perfil genèric:** Tècnic/a Especialitzat/da de Suport a la Recerca**Tipologia contractual:** Contracte d'activitats científicotècniques
Grup: 3 **CLT:** U**Retribució bruta anual:** 28.546,42 €/anuals (per jornada completa)**Jornada:** 35 h./set.**Durada prevista del finançament vinculat inicialment a la contractació:**
16 mesos **Data Inici:** 3/3/2025

DADES DEL PROJECTE

Nom del projecte: "TSI-069100-2023-15 - Cátedra CHIP-Chips para arquitecturas avanzadas y sistemas fotónicos"**Informació del projecte:****Codi:** K-00586**Convocatòria:** CÀTEDRA CHIP**Euraxess:** <https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/316849>

PROCÉS DE SELECCIÓ

Inscripció: Les persones interessades haureu d'omplir el [formulari](#).
Les incidències que puguin sorgir durant la inscripció de la candidatura s'han de reportar al correu electrònic: personalinvestigador.sp@upc.edu**Termini de presentació de sol·licituds:** 24 de febrer de 2025**Composició del tribunal:**
Representant unitat: David Artigas Garcia
Suplent: José Antonio Rubio Sola
Representant del Servei de Personal: Lourdes Moreno de Francisco
Representant del Comitè PasL: Per determinar**Data constitució del tribunal:** 27 de febrer de 2025 a les 12:00 hores mitjançant l'eina Google Meet**Convocatòria a la prova i/o entrevista:** En cas de que el tribunal acordi realitzar proves i/o entrevistes aquestes es realitzaran el dia 3 de març de 2025. La comunicació dels candidats/de les candidates preseleccionats/preseleccionades, el lloc i l'hora de realització es comunicarà mitjançant aquesta mateixa web.

Les persones candidates han de tenir disponibilitat per dur a terme la prova i/o entrevista mitjançant l'eina informàtica Google-meet.

TÈCNIC/A DE SUPORT A LA RECERCA 150-710-245

REQUISITS

Formació professional de grau superior (FP2), cicles formatius de grau mitjà, batxillerat o una titulació equivalent.

La superació de la prova d'accés a la universitat per majors de 25 anys serà equivalent al batxillerat, per l'accés a treballs públics o privats, en aquests dos casos, com regula l'apartat 4.3 de l'esmentada Ordre:

- Si acredita que té la superació de la prova d'accés a la universitat de majors de 25 anys + Títol d'ESO;
- Si acredita que té la superació de la prova d'accés a la universitat de majors de 25 anys + superació de 15 crèdits ECTS, o més, d'estudis universitaris.

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL

Missió

- Col·laborar en la generació, monitorització i processament de l'aleatorietat mitjançant tecnologies quàntiques i fotòniques. Establint col·laboracions amb entitats com Quside i ICFO.

Funcions a desenvolupar

- Cooperar amb l'enginyer quàntic i l'equip de desenvolupament de producte.
- Col·laborar en la construcció i en millorar el dispositiu de proves electro-òptiques per mesurar circuits integrats i components òptics.
- Participar en el desenvolupament d'algorismes de control automatitzat per als dispositius de prova.
- Ajudar en la anàlisi dels resultats de les mesures i resoldre problemes.
- Contribuir en la documentació i en la informació dels resultats de les proves als parts interessades.

PERFIL PROFESSIONAL

- **Estudis** Batxillerat o Cicle Formatiu de Grau Superior
- **Especialitat** Científic o Tecnològic

Coneixements

- Processament de senyals òptics.
- Automatització i tractament de dades.
- Català, castellà i anglès parlats, llegits i escrits.

TÈCNIC/A DE SUPORT A LA RECERCA 150-710-245

Competències Tècniques

- Proves electroòptiques de PIC: anàlisi de espectre òptic, làsers ajustables,...
- Python, Octave.

Competències Organitzatives

- Treball en equip multidisciplinaris.

Competències Funcionals

- Habilitats comunicatives.

Experiència Professional

- Es valorarà experiència en funcions similars a les descrites, específicament, en el desenvolupament d'activitats de recerca, tant en l'entorn universitari com industrial.

**Proyecto financiado por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras
Digitales y por la Unión Europea-Next Generation EU**